PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 07015033 A

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

50

(43) Date of publication of application: 17.01.95

(51) Int. CI

H01L 33/00

(21) Application number: 05157592

(22) Date of filing: 28.06.93

(71) Applicant:

JAPAN ENERGY CORP

(72) Inventor:

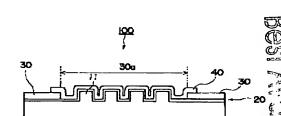
MOMOI HAJIME NODA AKIRA

(54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve output and response speed and obtain a device suitable to a light source for optical communication, by decreasing the density of a current injected in a light emitting region, improving the linearity of current- optical output characteristics up to a high output region, increasing the maximum value of available luminous intensity, and improving the upper limit of signal transmission speed.

CONSTITUTION: An LED 100 has the structure wherein the central part of the main surface of a semiconductor substrate 10 is uneven, a semiconductor multilayered film 20 containing a light emitting layer 22 and an insulating film 30 are laminated in order along the uneven form, and an ohmic electrode 40 is formed in an aperture 30a of the insulating film 30. An ohmic electrode 50, and an aperture 50a for leading out light are formed on the rear of the semiconductor substrate 10. The light emitting layer 22 is constituted as a multiple quantum well structure formed by laminating a plurality of well layers.



50a

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-15033

(43)公開日 平成7年(1995)1月17日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H01L 33/00

A 7376-4M

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平5-157592

(22)出願日

平成5年(1993)6月28日

(71)出願人 000231109

株式会社ジャパンエナジー

東京都港区虎ノ門二丁目10番1号

(72)発明者 桃井 元

埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号 株式

会社日鉱共石内

(72)発明者 野田 朗

埼玉県戸田市新曽南3丁目17番35号 株式

会社日鉱共石内

(74)代理人 弁理士 荒船 博司 (外1名)

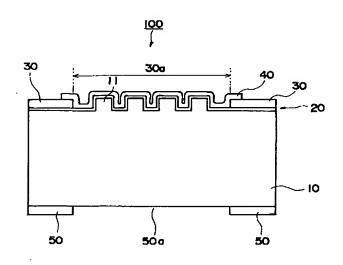
(54) 【発明の名称】半導体発光装置

(57) 【要約】

【目的】 高出力且つ高応答速度の半導体発光装置、特に光通信用の光源に利用して好適な面発光型LEDを提供する。

【構成】 LED100は、半導体基板10の主面の中央部が凹凸形状をなし、その凹凸形状に沿って発光層22を含む半導体多層膜20及び絶縁膜30が順次積層され、その絶縁膜30の開口部30aにオーミック電極40が設けられてなる構造をしている。半導体基板10の裏面には、オーミック電極50及び光取り出し用開口部50aが開けられている。発光層22は、さらに複数の井戸層が積層されてなる多重量子井戸構造になっている。

【効果】 発光領域に注入される電流の密度が低くなり、高出力に至るまで電流-光出力特性の直線性がよく、利用可能な発光強度の最大値が大きくなるので、信号の伝送速度の上限をより高くすることができる。従って、高出力且つ高応答速度の何れも満足させることができ、光通信用の光源として好適である。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板上に発光層を有する半導体多層膜よりなる発光領域が形成され、さらにその上にオーミック電極が形成されてなる半導体発光装置において、少なくとも前記発光領域における前記発光層は、複数の凸部又は複数の凹部を有する凹凸状に成形されており、その凹凸状に沿って前記オーミック電極が形成されていることを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2】 上記発光層は、比較的小さな禁制帯幅の 領域と比較的大きな禁制帯幅の領域とが交互に設けられ 10 てなる多重量子井戸構造になっていることを特徴とする 請求項1記載の半導体発光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体発光装置の構造 に関し、特に面発光型の発光ダイオードの構造に関す ス

[0002]

【従来の技術】光通信の光源として用いられる半導体発光素子には、レーザ・ダイオード(LD)の他に発光ダ 20 イオード(LED)がある。LED、特に活性層(発光層)に対して垂直な方向に光を取り出すことができる所謂面発光型LEDは、LDよりも、温度変動に起因する光出力変動が少ない、アナログ信号を伝送するのに適している、電流の大きさを簡便に設定することができるなどの利点を有しているため、加入者系の光通信網における近距離通信の光信号源として重要である。

【0003】従来の面発光型LEDは、図9に示すように、InPなどの半導体基板1上にクラッド層(又は、バッファー層)2、発光層3、クラッド層4、コンタクト層(キャップ層)5が順次平坦に積層された構造をなしている。そして、コンタクト層5上に積層された絶縁膜6の開口部6aにて電極7がコンタクト層5にオーミック接触している。一方、半導体基板1の裏面にはその基板1にオーミック接触する電極8が形成され、その電極8の中央には光取り出し用開口部8aが開けられている。上記電極7、8間に電圧を印加して電極7から8に向かって電流を流すことにより、発光層3で光が発生し、上記開口部8aより素子外部へ放射される。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記構造のLEDにあっては、光通信における伝送路である光ファイバーのコアーに光を効率よく入射させることができるように、発光層3の狭い領域(発光領域)に電流が注入されるようになっている。そのため、発光領域に注入される電流密度が高くなり、発光に関与しない電流の比率が急激に増してしまう。つまり、注入される電流値がある値を超えると、発光強度が電流の大きさに比例しない状態、所謂発光の飽和状態となってしまうという欠点があった。

【0005】この飽和状態の発生は、オージェ再結合過 50 が高くなる。即ち、従来よりも高電流を流して発光強度

程による非発光再結合、或は発光層内に注入されたキャリアがクラッド層 2、4に漏れ出す所謂キャリアのオーバーフロー現象が原因である。そして、これら非発光再結合やオーバーフロー現象は、非発光再結合により発生した熱で発光層の温度が上昇することにより、更に促進されてしまう。

【0006】従って、LEDを光通信に応用する場合、上記発光の飽和状態とならない電流域で発光させなければならず、実際に利用可能な発光強度の最大値は小さくなってしまうという問題があった。そのため、所定の信号純度(シグナルーノイズ比)を維持するには、発光強度に反比例して決まる信号の伝送速度の上限、即ちデジタル信号のパルス周期(ビットレート)の上限が低くなってしまうという問題を生じていた。従って、高出力及び高応答速度の何れも満足するのは無理であった。

【0007】本発明は、上記問題点を解決するためになされたもので、高出力且つ高応答速度の半導体発光装置、特に光通信用の光源に利用して好適な面発光型LEDを提供することを目的としている。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、半導体基板上に発光層を有する半導体多層膜よりなる発光領域が形成され、さらにその上にオーミック電極が形成されてなる半導体発光装置において、少なくとも前記発光領域における前記発光層は、複数の凸部又は複数の凹部を有する凹凸状に成形されており、その凹凸状に沿って前記オーミック電極が形成されているようにしたものである。また、上記発光層は、比較的小さな禁制帯幅の領域と比較的大きな禁制帯幅の領域とが交互に設けられてなる多重量子井戸構造になっているとする。

[0009]

【作用】上記手段によれば、発光領域における発光層が 凹凸状に成形されているため、従来の発光層が平坦な構 造のものに較べて、発光層の面積が大きくなる。例え ば、発光層において、一辺の長さWの平面正方形をなす 凸部が一辺の長さ2Wの正方形の桝目の中央に設けられ ており、凹凸構造の段差(高さ)が長さLである時(図 2及び図3参照)、発光層の面積はS1は、平坦な構造 における同面積S2に対し、次式で表される。

40 S 1/S 2 = 1 + (L/W)

この式においてL/Wで表されたアスペクトレシオが1以下の場合には、凹凸をエッチングにより容易に形成可能であるので、その範囲にけるS1/S2の最大値は、L=Wの時に得られ、その時の値は2となる。即ち、発光層を凹凸形状とすることにより、その面積が最大、従来の2倍となる。

【0010】従って、従来の場合と同じ大きさの電流を発光領域に流しても、その領域に注入される実効的なキャリア濃度が低くなり、発光の飽和状態の生じる電流値が高くなる。即ち、従来とりも真理流を流して発光強度

20

を高くしても発光の飽和状態が起き難く、高出力に至るまで電流ー光出力特性の直線性がよくなる。そのため、利用できる発光強度の最大値が大きくなるので、光通信用の発光源として使用した場合に、所定の信号純度を維持可能な信号の伝送速度の上限がより高くなる。また、発光領域自体は従来のものに較べて大きくならないので、光ファイバーのコアーに光を効率よく入射させることができ、光ファイバーとの結合効率が向上する。

【0011】さらに、凹凸状の発光層に沿ってオーミック電極が形成されているため、電極面積が広くなって電 10極抵抗が低くなる。この抵抗はダイオードと直列に接続されているため、この抵抗において消費される電力が低減され、発光素子に投入した電力のうち発光出力として取り出される電力の割合が高くなる。即ち、発光効率が向上する。加えて、その電極抵抗における発熱が低減し、発光層の温度上昇が抑制される。従って、オージェ再結合等の非発光再結合の寄与が低減されるので、発光の飽和状態がより一層起こり難くなる。

[0012]

【実施例】本発明に係る半導体発光装置の一例を、図1 乃至図8に示し、説明する。図1には、本発明に係る半 導体発光装置を適用したLEDが示されている。同図に 示すように、このLED100は、n-InP(以下、 導電型がn型の時は「n-」と記述し、p型の時は「p -」と記述する。)などからなる半導体基板10の主面 の中央部が凹凸形状をなしており、その主面上に半導体 多層膜20及び絶縁膜30が順次積層され、その絶縁膜 30の中央部、即ち前記凹凸形状部分に対応する箇所に 設けられた開口部30aにてp-電極40が半導体多層 膜20にオーミック接触してなる構造をしている。-方、半導体基板10の裏面には、その基板10にオーミ ック接触するn-電極50が形成され、その電極50の 中央には光取り出し用開口部50 aが開けられており、 半導体多層膜20中の発光層22 (図2参照)で発せら れた光はその開口部50aよりLED100の外部へ放

【0013】図2には、LED100の凹凸形状部分が拡大して示されている。同図に示すように、半導体多層膜20は、クラッド層(又は、バッファー層)21、発光層(活性層)22、クラッド層23、コンタクト層(キャップ層)24が順次積層されてなる構造をしており、半導体基板10の凹凸形状に沿って設けられている。ここで、例えば、クラッド層21はn-InPなどからなり、発光層22とクラッド層23とコンタクト層24はp-InGaAsPなどからなる。

【0014】図3には、上述した凹凸形状部分における 凸部11の配置の一例が示されている。同図に示すよう に、その凸部11は、例えば、発光層22における平面 形状が一辺の長さWの正方形をなしており、一辺の長さ 2Wの正方形の桝目(一点鎖線で示した。)の中央に設 50 けられている。そして、その凸部11の発光層22における高さLは、好ましくは前記W以下である(図2参照)。なお、半導体基板10においての凸部11の高さを半導体多層膜20の厚さの少なくとも2倍以上とする。また、半導体基板10においての隣り合う凸部11,11間の距離も半導体多層膜20の厚さの少なくとも2倍以上とするが、好ましくは、上述したように、発光層22において、凸部11の一辺の長さ(W)と隣り合う凸部11,11間の距離(W)とが略等しくなるようにするのがよい。

【0015】図4には、発光層22が拡大して示されている。同図に模式的に示したように、発光層22は、さらに複数層、特にその数を限定しないが、例えば5層の半導体層(井戸層)220,221,222,223,224が障壁層を介して積層されてなる多重量子井戸構造になっている。それら各井戸層220,…間の厚さtは、InGaAsPの場合にはその屈折率が3.6程度であるため、好ましくは次式を満たすとよい。

 $t = \lambda/2n$ (λ は真空中における発光波長、nは 発光層 22の実質的な屈折率である。) この式を満たす 厚さの時には、位相が揃い易く、隣合う井戸層 220と 221、221と22、222と23、223と24、においては、発せられた各光の電界強度の大きいところ(振幅でいうと腹に当たるところ)が相互に一致 するので相互作用を起こし易く、反射の効果も生じる。 つまり、各井戸層 220, …で発せられた光が、相互に 干渉し合って増幅されることになる。

【0016】図5には、上記量子井戸構造をなす発光層 22のエネルギーバンド図が模式的に示されている。同 図に示すように、バンド構造は、比較的小さな禁制帯幅 (バンドギャップ) E_t の領域と比較的大きな禁制帯幅 E_s の領域とが交互に繰り返された構造となっている。 なお、同図において、 E_t は伝導帯のエネルギーレベルを表し、 E_t は価電子帯のエネルギーレベルを表している。

【0017】以上の構造のLEDの製造プロセスに付いて図1及び図2を参考にして説明する。先ず、半導体基板10の主面にレジストを塗布し、上述した凹凸形状に対応したパターンを有するマスクを用いて、露光・現像を行い、そのマスクパターンをレジストに転写する。そして、ベーク処理を行った後、レジストの残存部分をエッチングマスクとして、ECR(電子サイクロトロン共鳴)エッチャーにより半導体基板10をエッチングする。エッチングマスクを除去した後、MOCVD(有機金属化学気相成長)法によりクラッド層21、発光層22、クラッド層23、コンタクト層24を順次エピタキシャル成長させる。

【0018】さらに、コンタクト層24上に絶縁膜30 及び電極40を形成する。電極40は、コンタクト層2 4上に堆積させた金属膜(例えば、AuZn/Ti/P

t/Au)をアロイ化等の工程によりオーミック性半導 体ー金属接触させることにより得られる。また、半導体 基板10の裏面に光取り出し用開口部50a及びn-電 極50を設ける。

【0019】次に、具体例及び従来例を示す。

(具体例及び従来例) この具体例では、図6に示すよう に、光取り出し用開口部50aにモノリシックレンズ6 0が形成されてなるLED110を用いた。また、従来 例では、図9に示したLEDにおいて、光取り出し用開 口部8aにモノリシックレンズを形成してなるものを用 10 いた。何れも発光波長は1.5μm帯である。具体例に おいては、従来例よりも発光出力が50%向上した。ま た、それぞれのスペクトルを測定して比較したところ、 具体例では従来例よりもエネルギーが若干高い方にシフ トしているとともに、半値幅も20nm狭くなっていた。

【0020】なお、LED110においては、図3に示 した升目の大きさ、即ちWを1 μm、ECRエッチャー による半導体基板 1 0 のエッチング量を約 1 μm、半導 体多層膜20の厚さを0.4 μm、凹凸形状部分の大き さを直径約20 μm、モノリシックレンズ60の曲率半 20 す模式断面図である。 径を130μmとした。

【0021】なお、半導体基板10や半導体多層膜20 の各層やp-電極40などの材質は上記実施例のものに 限定されないのはいうまでもない。即ち、InGaAs P系のLEDに限らず、AlGaInP系やAlGaA s系など種々の材質よりなるLEDにおいても同様の効 果が得られる。また、凹凸形状部分の大きさや半導体多 層膜20の厚さなどの各種寸法に付いても上記実施例の 数値に限定されないのはいうまでもない。例えば凸部1 1の平面正方形の一辺の長さは、0.5~10μm程度 30 ズ付型のLEDの例を示す模式断面図である。 の間で任意に設定することができる。さらに、発光波長 に付いても特に限定せず、任意である。

【0022】さらにまた、発光層22が量子井戸構造と なっていなくても従来に較べて髙出力が得られるのは勿 論であるし、井戸層の数も1層でもよいし、2層以上で もよい。また、凸部11の代わりに、凹部(穴)が形成 されていてもよい。

【0023】また、図7に示したように、半導体基板1 0の裏側に設けた穴50bにレンズ70を樹脂80で固 定してなるレンズ付型LED120にも本発明を適用す 40

ることができるのはいうまでもない。さらに、図8に示 すように、凸部11の平面形状が円形であってもよい し、その他の形状であってもよい。

[0024]

【発明の効果】本発明に係る半導体発光装置によれば、 発光領域における発光層が凹凸状に成形されており、そ の凹凸状に沿ってオーミック電極が形成されてなる構造 であるため、発光領域に注入される電流の密度が低くな り、高出力に至るまで電流-光出力特性の直線性がよ く、従来よりも利用可能な発光強度の最大値が大きくな るので、信号の伝送速度の上限をより高くすることがで きる。従って、高出力且つ高応答速度の何れも満足させ ることができ、光通信用の光源として好適である。さら に、出力特性や応答特性の性能は、上記発光層を多重量 子井戸構造とすることにより、一層優れたものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る半導体発光装置を適用したLED の一例を示す模式断面図である。

【図2】そのLEDにおける凹凸形状部分を拡大して示

【図3】そのLEDにおける凸部の配置の一例を示す模 式平面図である。

【図4】そのLEDの発光層を拡大して示す模式断面図 である。

【図5】量子井戸構造をなす発光層のエネルギーバンド 構造を示す模式図である。

【図6】本発明に係る半導体発光装置を適用したモノリ シックレンズ型のLEDの例を示す模式断面図である。

【図7】本発明に係る半導体発光装置を適用した球レン

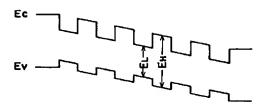
【図8】凸部の配置の他の例を示す模式平面図である。

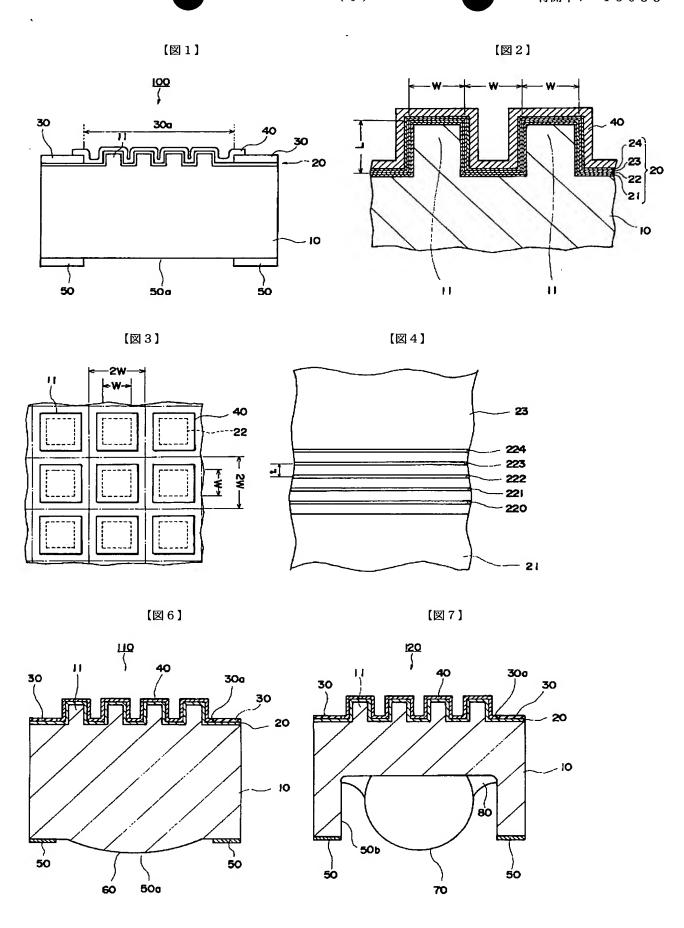
【図9】従来のLEDの模式断面図である。

【符号の説明】

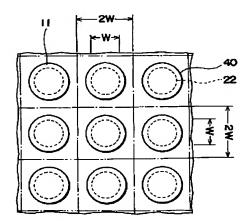
- 10 半導体基板
- 11 凸部
- 20 半導体多層膜
- 22 発光層
- 40 p-電極 (オーミック電極)
- 100, 110, 120 LED (半導体発光装置)

【図5】

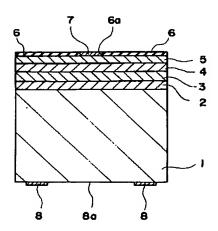








【図9】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.